



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23428XA

Issue Date: 25 Aug 2020

Title of Change:	Bucheon 8inch FRD rectifiers dual source in CZ4						
Proposed First Ship date:	11 Jan 2021 or earlier if approved by customer						
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or David.Zhu@onsemi.com						
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or PCN.samples@onsemi.com . Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.						
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact PCN.Support@onsemi.com						
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Affected products will be identified with date code						
Change Category:	Test Change, Wafer Fab Change						
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition						
Sites Affected:							
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites						
ON Semiconductor Bucheon, Korea	None						
ON Semiconductor Roznov, Czech Republic							
Description and Purpose:							
Bucheon Korea 8inch FRD rectifier dual source in CZ4 Czech Republic.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Before Change Description</th><th>After Change Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manufacturing locations for Wafer Fab and Probe Test</td><td>ON Semiconductor Bucheon, Korea</td><td>ON Semiconductor Bucheon, Korea ON Semiconductor Roznov, Czech Republic</td></tr> </tbody> </table>		Before Change Description	After Change Description	Manufacturing locations for Wafer Fab and Probe Test	ON Semiconductor Bucheon, Korea	ON Semiconductor Bucheon, Korea ON Semiconductor Roznov, Czech Republic
	Before Change Description	After Change Description					
Manufacturing locations for Wafer Fab and Probe Test	ON Semiconductor Bucheon, Korea	ON Semiconductor Bucheon, Korea ON Semiconductor Roznov, Czech Republic					
There is no product marking change as a result of this change							

**Qualification Plan:**

QV1 DEVICE NAME: FGH75T65SHD-F155

RRF: 68330, 68385

PACKAGE: TO247

Device will follow the generic plans shown below:

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, 100% max rated V	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta = +25°C, delta Tj = 100°C, on/off = 5 min	6000 cyc
RSH	JESD22-B106	Ta = 265°C, 10 sec	

QV2 DEVICE NAME: FFA60UA60DN

RRF: 68327, 68386

PACKAGE: TO3P

Device will follow the generic plans shown below:

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, 80% max rated V	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta = +25°C, delta Tj = 100°C, on/off = 2 min	15000 cyc
RSH	JESD22-B106	Ta = 265°C, 10 sec	



QV3 DEVICE NAME: FFH30S60STU

RRF: 68326, 68387

PACKAGE: TO247

Device will follow the generic plans shown below:

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C , 80% max rated V	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec	

QV4 DEVICE NAME: RHRG75120

RRF: 68323, 68388

PACKAGE: TO247

Device will follow the generic plans shown below:

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C , 80% max rated V	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec	

Estimated date for qualification completion: 21 August 2020

Electrical Characteristics Summary

Electrical characteristics are not impacted

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
RHRG30120	RHRG75120
RHRP30120-F102	RHRG75120
RHRP30120	RHRG75120
RHRG75120	RHRG75120
RHRP15120	RHRG75120
FGH40T65SQD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGA30N65SMD	FGH75T65SHD-F155
FGA30T65SHD	FGH75T65SHD-F155
FGA40N65SMD	FGH75T65SHD-F155
FGA40T65SHD	FGH75T65SHD-F155
FGA5065ADF	FGH75T65SHD-F155
FFH75H60S	RHRG75120
RHRP1560	RHRG75120
HGTG12N60C3D	RHRG75120
RHRG1560CC	RHRG75120
RHRP1560-F102	RHRG75120
RHRP860	RHRG75120
RHRP860-F102	RHRG75120
RHRP3060	RHRG75120
HGTG20N60B3D	RHRG75120
RHRG3060	RHRG75120
RHRG3060CC	RHRG75120
RHRP3060-F102	RHRG75120
FGAF40N60SMD	RHRG75120
ISL9K3060G3	RHRG75120
ISL9R3060G2	RHRG75120
ISL9R3060P2	RHRG75120
FFA60UA60DN	FFA60UA60DN
FFAF60UA60DN	FFA60UA60DN



FFPF30UA60S	FFA60UA60DN
FFH30S60STU	FFH30S60STU
FFP30S60STU	FFH30S60STU
FFH60UP60S	FFH30S60STU
FFH60UP60S3	FFH30S60STU
RURG8060	FFH30S60STU
RHRP15120-F102	RHRG75120
RHRP8120	RHRG75120
RHRP8120-F102	RHRG75120
FGH40T120SMD-F155	RHRG75120
FGH40T120SMD	RHRG75120
FGY40T120SMD	RHRG75120
FGH40T65SHD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH40T65SPD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH40T65UPD	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SHD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65UPD	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SQD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65UPD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SHDTL4	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SHDT-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SQDT-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SQDTL4	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SHDTLN4	FGH75T65SHD-F155

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23428XA

発行日: 25 Aug 2020

変更件名:	富川に加えて CZ4 からの 8 インチ FRD レクティブアイヤのデュアルソース化	
初回出荷予定日:	11 Jan 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < David.Zhu@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	影響を受ける製品は日付コードで識別されます。	
変更カテゴリ:	検査の変更、ウェハー工場の変更	
変更サブカテゴリ:	製造拠点の追加	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
オン・セミコンダクター 富川、韓国	なし	
オン・セミコンダクター ロジノフ、チェコ共和国		
説明および目的:		
8 インチ FRD レクティブアイヤを富川 (韓国) に加えて CZ4 (チェコ共和国) からデュアルソースとします。		
	変更前	変更後
ウェハー工場および プローブ検査のための 製造拠点	オン・セミコンダクター 富川、韓国	オン・セミコンダクター 富川、韓国 オン・セミコンダクター ロジノフ、チェコ共和国
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。		



認定計画:

デバイス名: FGH75T65SHD-F155

RMS: 68385

パッケージ: TO247

製品は以下に示す一般的な計画に従います。

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, 100% max rated V	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs
UHASt	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec	

デバイス名: FFA60UA60DN

RMS: 68386

パッケージ: TO3P

製品は以下に示す一般的な計画に従います。

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, 80% max rated V	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs
UHASt	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =2 min	15000 cyc
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec	



デバイス名: FFH30S60STU

RMS: 68387

パッケージ: TO247

製品は以下に示す一般的な計画に従います。

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, 80% max rated V	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec	

デバイス名: RHRG75120

RMS: 68323, 68388

パッケージ: TO247

製品は以下に示す一般的な計画に従います。

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, 80% max rated V	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85%RH, 18.8 psig, bias	96hrs
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85%RH, 18.8 psig, unbiased	96hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -55°C to +150°C	1000 cyc
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
IOL	MIL STD750 (M 1037) AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C,on/off =5 min	6000 cyc
RSH	JESD22- B106	Ta=265°C, 10 sec	

認定完了予定日: 21 August 2020

電気的特性の要約:

電気的特性に影響はありません。



影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
RHRG30120	RHRG75120
RHRP30120-F102	RHRG75120
RHRP30120	RHRG75120
RHRG75120	RHRG75120
RHRP15120	RHRG75120
FGH40T65SQD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGA30N65SMD	FGH75T65SHD-F155
FGA30T65SHD	FGH75T65SHD-F155
FGA40N65SMD	FGH75T65SHD-F155
FGA40T65SHD	FGH75T65SHD-F155
FGA5065ADF	FGH75T65SHD-F155
FFH75H60S	RHRG75120
RHRP1560	RHRG75120
HGTG12N60C3D	RHRG75120
RHRG1560CC	RHRG75120
RHRP1560-F102	RHRG75120
RHRP860	RHRG75120
RHRP860-F102	RHRG75120
RHRP3060	RHRG75120
HGTG20N60B3D	RHRG75120
RHRG3060	RHRG75120
RHRG3060CC	RHRG75120
RHRP3060-F102	RHRG75120
FGAF40N60SMD	RHRG75120
ISL9K3060G3	RHRG75120
ISL9R3060G2	RHRG75120
ISL9R3060P2	RHRG75120
FFA60UA60DN	FFA60UA60DN
FFAF60UA60DN	FFA60UA60DN
FFPF30UA60S	FFA60UA60DN
FFH30S60STU	FFH30S60STU



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23428XA

発行日: 25 Aug 2020

FFP30S60STU	FFH30S60STU
FFH60UP60S	FFH30S60STU
FFH60UP60S3	FFH30S60STU
RURG8060	FFH30S60STU
RHRP15120-F102	RHRG75120
RHRP8120	RHRG75120
RHRP8120-F102	RHRG75120
FGH40T120SMD-F155	RHRG75120
FGH40T120SMD	RHRG75120
FGY40T120SMD	RHRG75120
FGH40T65SHD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH40T65SPD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH40T65UPD	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SHD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65UPD	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SQD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65UPD-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SHDTL4	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SHDT-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SQDT-F155	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SQDTL4	FGH75T65SHD-F155
FGH75T65SHDTLN4	FGH75T65SHD-F155